

Specyfikacja techniczna detektora CCD KRC (KRC1-000-UM)

Zawartość kompletu Detektora KRC:

- Jednostka elektro-optyczna (nazwana EOU);
- Stacja robocza WS technika;
- Pakiet oprogramowania;
- Kable;
- Dokumentacja.

Na życzenie klienta każda wersja jednostki EOU może być dostarczona w różnych konfiguracjach komponentowych:

- Z kratką przeciwrozproszeniową lub bez.
- EOU dostarczona jest z komorami jonizacyjnymi lub bez.
- Kratka przeciwrozproszeniowa dostarczana jest z $r = 6 \div 16$ oraz odległości ogniskowej $F0 = 100 \div 180$ cm.
- Kratka przeciwrozproszeniowa może być zintegrowana w EOU, jak również wymienna.
- Jeśli dostarczony zostaje detektor bez stacji roboczej WS technika, dołączona jest do niego płyta z interfejsem ELBUS-PCI.
- Na życzenie klienta płyta z interfejsem RS232-USB-CAN przeznaczona do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami poprzez interfejs CAN-OPEN może zostać dołączona.

Wymiary, mm, nie więcej niż:

- EOU 480 x 530 x 700
- WS 600 x 300 x 650

Waga, nie więcej niż :

- EOU 48kg.
- WS 25kg.

Okres rozgrzewania: nie więcej niż 10 min. (po włączeniu).

Napięcie zasilania WS: $\sim(110-240)$ VAC $\pm 10\%$ jedno-faz. Częstotl.: (50-60) Hz ± 1 Hz.

Maksymalna moc na wejściu: nie więcej niż - 250 VA

Zasilanie EOU : $+31 \pm 2$ V AC, wygenerowane przez interfejs ELBUS -PCI interface.

Tabela

Parametr	KRC 4A	KRC 5A	KRC 9	KRC 9C	KRC 16	KRC16C	KRC9N	KRC9NC	KRC16N	KRC16NC
Rozmiar pola wejściowego , mm, nie mniej niż	395x395	320x385	395x395	395x395	395x395	395x395	430x430	430x430	430x430	430x430
Matryca akwizycji	2Kx2K	2Kx2.5K	3Kx3K	3Kx3K	4Kx4K	4Kx4K	3Kx3K	3Kx3K	4Kx4K	4Kx4K
Rozmiar pixela, μ m	193	156	130	130	97	97	140	140	105	105
Rozdzielczość przestrzenna, lp/mm, nie mniej niż	2.6	3.2	3.8	3.8	5.1	5.1	3.6	3.6	4.8	4.8
Wykrywająca Wydajność Kwantowa (DQE), % nie mniej niż	8	11	21	30	18	27	26	38	24	35

Parametr	KRC 4A	KRC 5A	KRC 9	KRC 9C	KRC 16	KRC16C	KRC9N	KRC9NC	KRC16N	KRC16NC
Zakres dynamiczny, dB nie mniej niż	72	72	76	76	76	76	76	76	76	76
Poziom kwantyzacji, bit	14	14	16	16	16	16	16	16	16	16
Nieregularność, % nie więcej niż	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5
Zniekształcenie, % nie więcej niż	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Ekspozycja-WS czas transferu danych, ms, nie więcej niż	1200	1500	1500	1500	2200	2200	1500	1500	2200	2200

Uwaga: Zgodnie z EN62220